



## 사전 분석: 업계 고해상도 혁신

모든 빔 전파 알고리즘에 적합한 입력 값을 결정하는 것은 어려울 수 있습니다. BPS의 기반으로 분석 설정을 자동으로 추천하고 최단 시간에 정확한 답변을 제공합니다.

사전 분석 기능은 렌즈 기반...

사전 분석 기능은 프로브 빔릿의 하위 세트를 사용하여 시스템을 빠르게 스캔하고 다음을 포함한 주요 입력에 대한 권장 값을 제공합니다:

- 입력 필드 샘플링
- 면 재생...
- 면 클립 검사
- 출력 그리드 위치, 크기 및 샘플링

사전 분석은 또한 권장 값을 기반으로 분석 실행 시간을 예측합니다



그림 4: Beamlet 풋프린트 플롯

- 빔렛 풋프린트 플롯 (위 그림에 표시됨)
- 단면 슬라이스 플롯
- 래스터 플롯
- 시뮬레이션 플롯
- 경사 투영 플롯
- 가우시안 빔 테이블

빔렛 세트를 렌즈 시스템의 모든 위치에 저장하고 다음 섹션의 후속 실행을 위한 입력값으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 시스템 섹션을 분석하고 계산 효율성을 높일 수 있습니다.

## Advanced Propagation 제어 기능

제품을 능숙하게 사용하기 위해 고급 사용자를 위해 BSP는 전파 프로세스, 임계값 및 매개변수에 대한 높은 수준의 제어 기능을 제공합니다. 다음을 위한 제어 기능이 제공됩니다.

- P
- Treatment Variation Checking
- Clip Checking Fidelity
- Computational Accuracy

## 다양한 응용 분야 전용 가능

비점 빔, 편광 광학 필드 입력, 낮은 f-수(예: 마이크로리소그래피 렌즈) 또는 비연속 pupil이 있는 BSP로 정확하게 분석됩니다. 이 기능은 near-field 회절 분석 및 회절격자, 위상판 또는 공'필터와 초점 근처에서 집속 또는 위상이 수정되는 광학 시스템에 유용합니다. BSP는 파장 및 편광을

CODE V에 대한 자세한 내용은 <https://www.synopsys.com/optical-solutions.html>를 [optics@synopsys.com](mailto:optics@synopsys.com)으로 이메일을 보내십시오.